

1.5 DIBE 中杂质的分析—GC

(使用带预切割进样器的系统 GC 进行快速分析)

■说明

在气相色谱法中,有时为了等待定性定量上不需要的高沸点成分的洗脱而增长分析时间。在这种情况下,使用附有预柱进样器的 GC 系统,不需要的高沸点成分在预柱中捕集,并进行反吹以达到缩短分析时间的目的。

本文介绍使用带预切割进样器的系统 GC 对 DIBE(Diisobutyl hexahydro phthalate)中杂质的分析例。

■前处理法

无。

■分析条件

Model	: GC-17A AFw ver.3 with Pre-cut GC System
Column	: DB-5 30m×0.32mm i.d. df=0.25μm
Col.Temp.	: 60°C(0.2min)-10°C/min-250°C(10min)
Inj.Temp.	: 250°C
Det.Temp.	: 280°C (w-FID)
Carrier Gas	: He 30cm/sec
Injection	: Split 1:30
Inj.Vol.	: 1μL
Precolumn	: OV-1 1.5% on Gaschrom Q 10cm

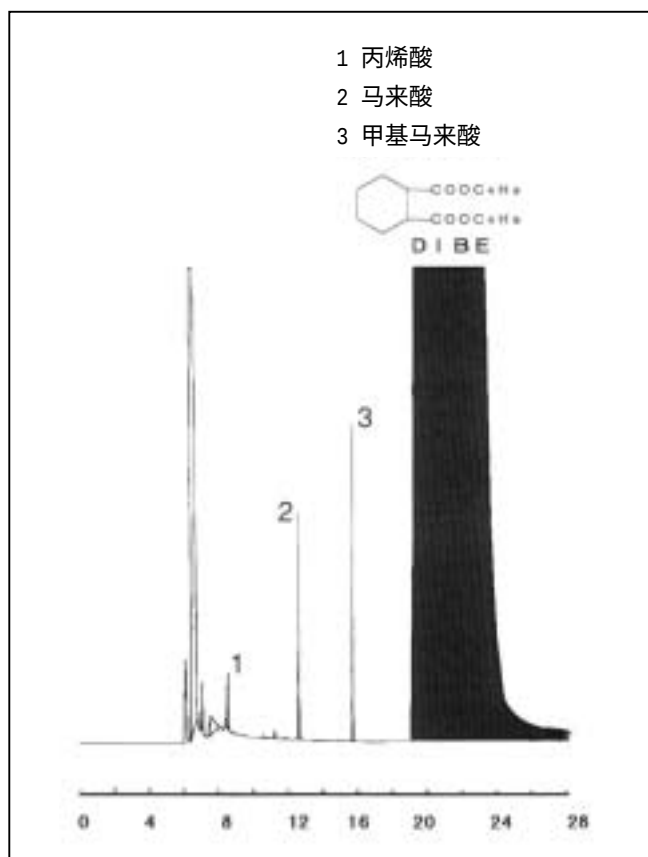


图 1.5.1 DIBE 中杂质的分析 (无预切割)

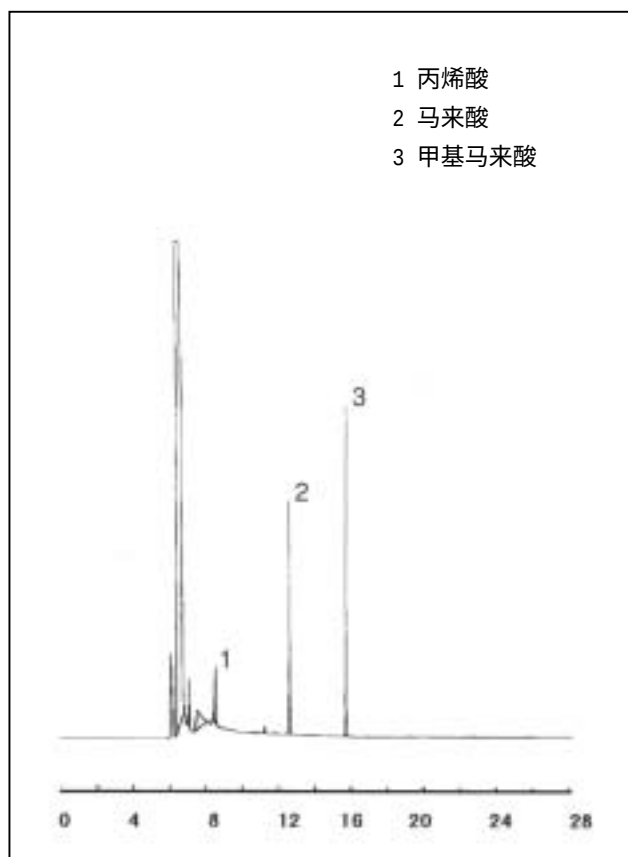


图 1.5.2 DIBE 中杂质的分析 (有预切割)